

LE-5400

High Speed
LED Spectrometer

LED高速光譜分析儀

即時LED光學特性高速評價

概要

LE-5400, 是一台可架設於生產線上與點燈訊號同步, 高速檢測LED光學特性的光譜儀。在提供速度的同時, 絲毫不減數據的穩定性。最適用於生產線上即時性的合格判定與級別分類。

特色

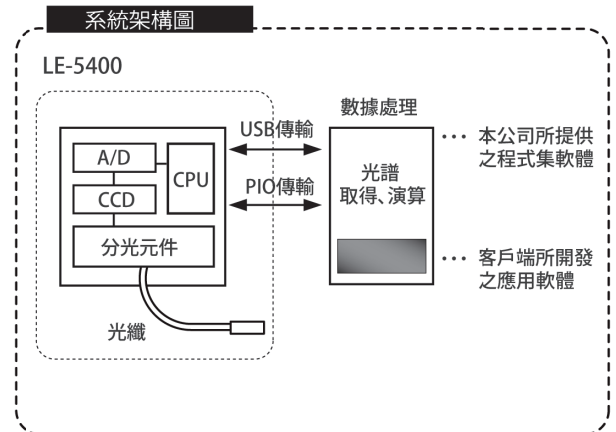
適用於各種In-line/Off-line環境的設計

- 可配合生產線, 或裝置中的點燈訊號同步量測。
- 自由靈活的光纖, 適用於各種環境的安裝架設。

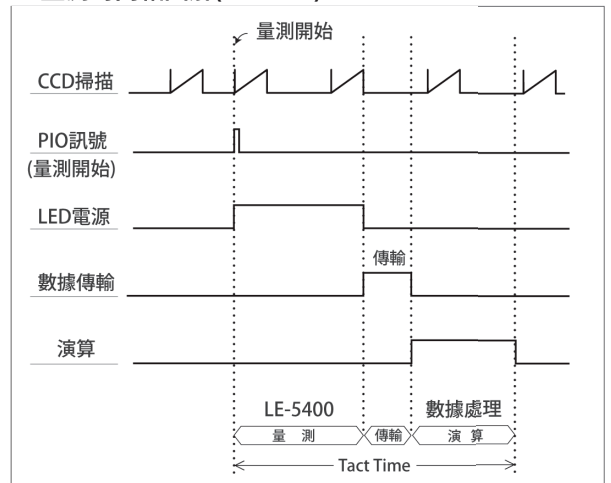
搭載 電子冷卻機能的高速量測

- 光柵式分光, 最短2ms^{*} 的曝光時間。
- 搭載電子冷卻機能的CCD感光元件, 可輕鬆應付長時間的連續量測。
- 最短15ms^{*} 的高速量測(含演算、數據處理)。

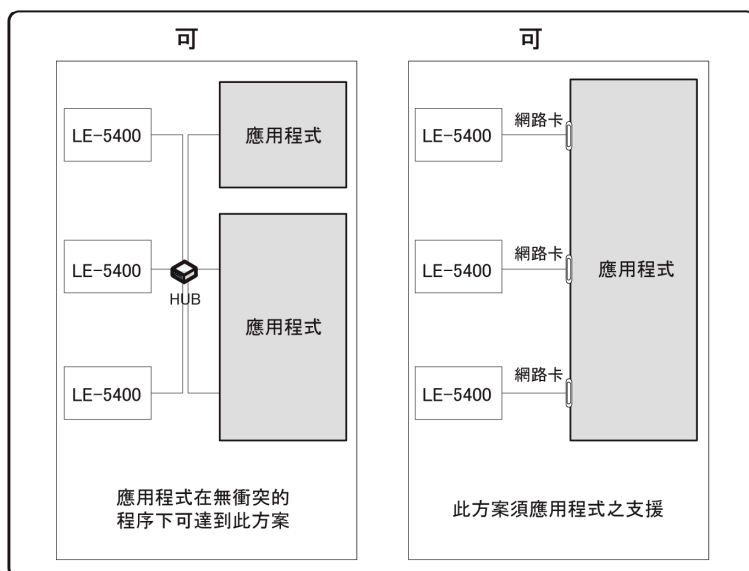
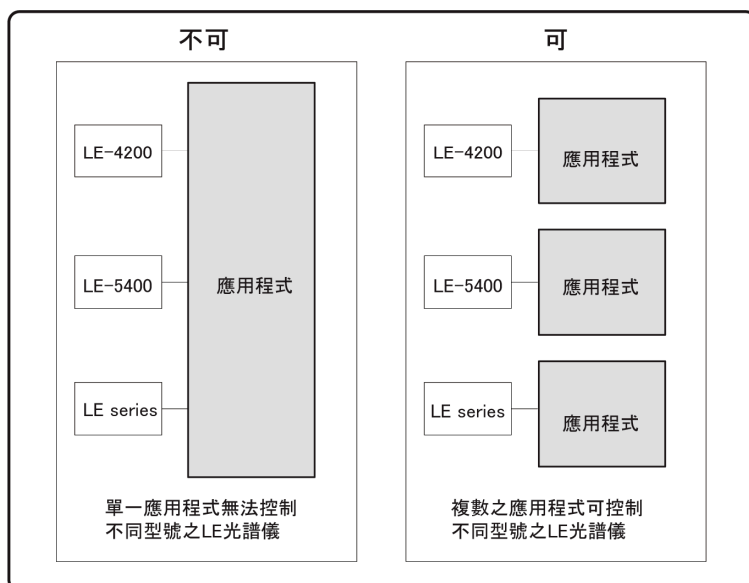
^{*} 視LED輝度、點燈方法、量測項目而有所差異



量測時間軸圖解(LE-5400)



■ 複數光譜分析儀之架構方案



■ 規格式樣

裝置名稱	LED高速光譜分析儀			
型號	LE-5400			
型式	A	B	C	D
波長範圍	380~960 nm	300~800 nm	330~1100 nm	350~930 nm
波長精度 *1	±0.3 nm *2	±0.3 nm *2	±0.5 nm *2	±0.3 nm *2
分光方式	光柵分光			
亮度、焦距	F=3, f=135mm			
分光元件	溝槽型全息成像光柵			
感光元件	CCD (電子冷卻機能)			
標準光纖 *3	長約2m, 外層金屬包覆, 固定口徑φ12mm, 與LED間之距離視指向性而異 (通常為2~8mm)			
消費電力	最大100 VA			
本體尺寸	280 (W) × 296 (D) × 160 (H) mm			
本體重量	約 10 kg			

架設環境	
適用溫度	20 ~ 35° C, 避免放置於溫度變化較劇烈處
理想濕度	30 ~ 80 %, 不適用於溫差過大、會導致霧氣凝結之環境
周圍環境	建議於通風良好好處使用, 避免放置於具有腐蝕性氣體之環境
供給電壓	AC100 / 230V 50 / 60Hz, 電壓供給穩定, 週遭無過大雜訊之環境

評價項目	
三刺激值 (kX, kY, kZ)*4	JIS Z 8724
色度座標 (x,y)	JIS Z 8724
色度座標 (u,v)	CIE 1960UCS
色度座標 (u',v')	CIE 1976UCS
主波長 (Dominant)、刺激純度 (Purity)	JIS Z 8701
相關色溫度、色偏差值(Duv)	JIS Z 8725
演色性評價數 (Ra,R1~R15)	JIS Z 8726
Peak波長 (λ max)、高度、半波寬	
第二Peak波長、高度	
積分值 (Summation)	
重心波長	
指定波長之高度	
依據Peak波長計算短波長段與長波長段之積分值	

- *1 波長校正用光源對汞物理輝線之確認值。
- *2 JIS Z 8724規格。
- *3 光纖之形狀、長度可變更。
- *4 視所量測之LED及光學系統受光部本身的差異, 亮度值(kY) 需在固定距離、位置、方向的量測條件下可達到再現性。

● 本公司保有價格、外觀、規格及附屬品等更新之權利

 Otsuka 大塚科技股份有限公司

- 台北營業所 台北市中山區松江路237號4樓
Tel.(02)2515-3066 Fax.(02)2515-3069
- 台南營業所 台南市中西區永福路一段189號7樓D2室
Tel. (06) 215-1970 Fax. (06) 215-1971

<http://www.otsuka-tw.com/>

MEMO:

17.03.06